

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
20. Januar 2005 (20.01.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2005/006002 A2

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G01R 31/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/051008

(22) Internationales Anmeldedatum:  
3. Juni 2004 (03.06.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 31 646.9 12. Juli 2003 (12.07.2003) DE  
10 2004 022 717.9 7. Mai 2004 (07.05.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): LEICA MICROSYSTEMS SEMICONDUCTOR  
GMBH [DE/DE]; Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetz-  
lar (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SÖNKSEN, Dirk  
[DE/DE]; Am Kirschbaum 3, 35641 Schöffengrund (DE).  
FRIEDRICH, Ralf [DE/DE]; Professorenweg 15, 35394  
Giessen (DE). DRAEGER, Andreas [DE/DE]; Zum  
Westergund 26, 35580 Wetzlar (DE). SCHUPP, Detlef  
[DE/DE]; Rolandstrasse 40, 57562 Herdorf/Dernbach  
(DE). VAN LUU, Thin [VN/DE]; Drei Stämme 27, 35576  
Wetzlar (DE). LANGER, Wolfgang [DE/DE]; Im Winkel  
19, 35578 Wetzlar (DE).

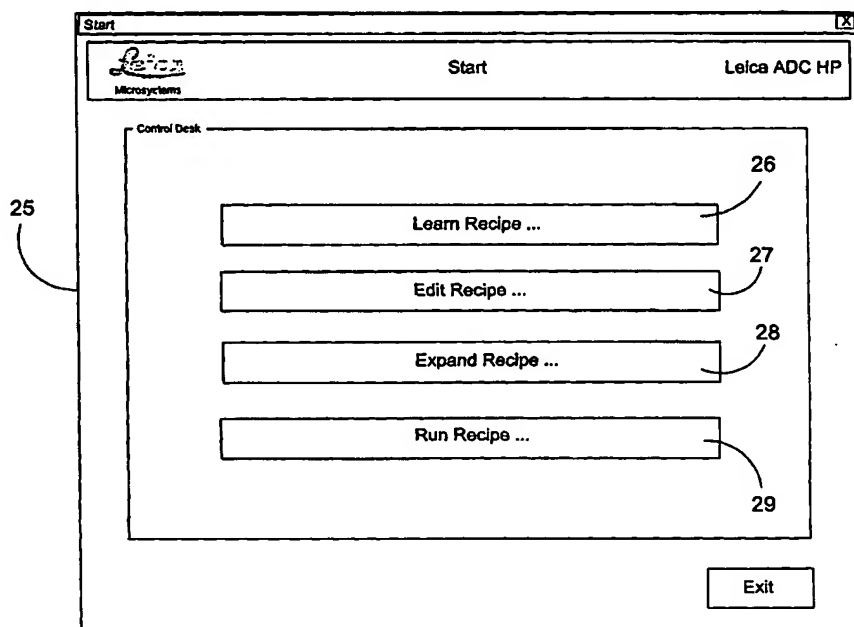
(74) Anwalt: REICHERT, Werner F.; Leica Microsystems  
AG, Corporate Patents + Trademarks Department, Ernst-  
Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD OF LEARNING A KNOWLEDGE-BASED DATABASE USED IN AUTOMATIC DEFECT CLASSIFICA-  
TION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM EINLERNEN EINER WISSENSBASIERTEN DATENBASIS FÜR DIE AUTOMATI-  
SCHE FEHLERKLASSIFIKATION



(57) Abstract: The invention relates to a method of learning a knowledge-based database used in automatic defect classification. According to said method, the user is spared a series of entries as the system carries out an automatic learn mode, which requires a reduced number of user entries.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/006002 A2

CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GR, GU, HD, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Erklärungen gemäß Regel 4.17:**

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GR, GU, HD, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

**Veröffentlicht:**

- ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
20. Januar 2005 (20.01.2005)

PCT

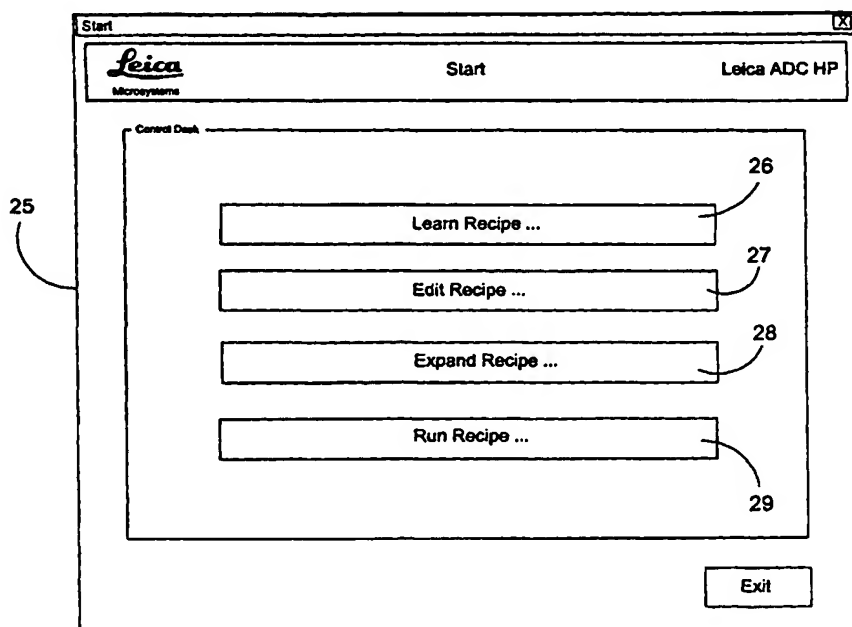
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2005/006002 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G06T 7/00, (72) Erfinder; und  
G01N 21/88 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SÖNKSEN, Dirk  
[DE/DE]; Am Kirschbaum 3, 35641 Schöffengrund (DE).  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/051008 FRIEDRICH, Ralf [DE/DE]; Professorenweg 15, 35394  
Giessen (DE). DRAEGER, Andreas [DE/DE]; Zum  
(22) Internationales Anmeldedatum: 3. Juni 2004 (03.06.2004) Westergund 26, 35580 Wetzlar (DE). SCHUPP, Detlef  
[DE/DE]; Rolandstrasse 40, 57562 Herdorf/Dermbach  
(25) Einreichungssprache: Deutsch (DE). VAN LUU, Thin [VN/DE]; Drei Stämme 27, 35576  
Wetzlar (DE). LANGER, Wolfgang [DE/DE]; Im Winkel  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch 19, 35578 Wetzlar (DE).  
(30) Angaben zur Priorität: 103 31 646.9 12. Juli 2003 (12.07.2003) DE (74) Anwalt: REICHERT, Werner F.; Leica Microsystems  
10 2004 022 717.9 7. Mai 2004 (07.05.2004) DE AG, Corporate Patents + Trademarks Department, Ernst-  
Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar (DE).  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
US): LEICA MICROSYSTEMS SEMICONDUCTOR jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
GMBH [DE/DE]; Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetz- AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
zlar (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD OF LEARNING A KNOWLEDGE-BASED DATABASE USED IN AUTOMATIC DEFECT CLASSIFICATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM EINLERNEN EINER WISSENSBASIERTEN DATENBASIS FÜR DIE AUTOMATISCHE FEHLERKLASSIFIKATION



(57) Abstract: The invention relates to a method of learning a knowledge-based database used in automatic defect classification. According to said method, the user is spared a series of entries as the system carries out an automatic learn mode, which requires a reduced number of user entries.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/006002 A3

CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, GR, GU, HD, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SI, SJ, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GI, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Erklärungen gemäß Regel 4.17:**

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, GR, GU, HD, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,

MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SI, SJ, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GI, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht  
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

10. Februar 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.